ţ	Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/765,265	DEBEER ET AL.
Examiner	Art Unit
Fric A Catos	3722

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
Updated	previous search	12/18/2007	EAG
	=		
			<u></u>

INT	ERFERENC	E SEARCH	IED
Class	Subclass	Date	Examiner
			-
			·

		DATE	EXMF
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			<u> </u>
		•	
·			
•			
	•		†
•			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		·	
			 -